Микроскоп электронный сканирующий EVEX Mini SEM SX-3000 с рентгенофлюоресцентным анализатором элементного состава, Carl Zeiss, Германия

Микроскоп электронный сканирующий EVEX Mini SEM SX-3000 с рентгенофлюоресцентным анализатором элементного состава– изучение морфологии поверхности образцов и их элементного состава.

ДИАПАЗОН УВЕЛИЧЕНИЙ – 20 ÷ 300,000 ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ – 0,03 ÷ 3000 мкм; ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ от C (углерода) до U (урана).

Объектами исследования являются твердые материалы и порошки, устойчивые к нагреву электронным лучом в вакууме и обладающие электропроводностью.